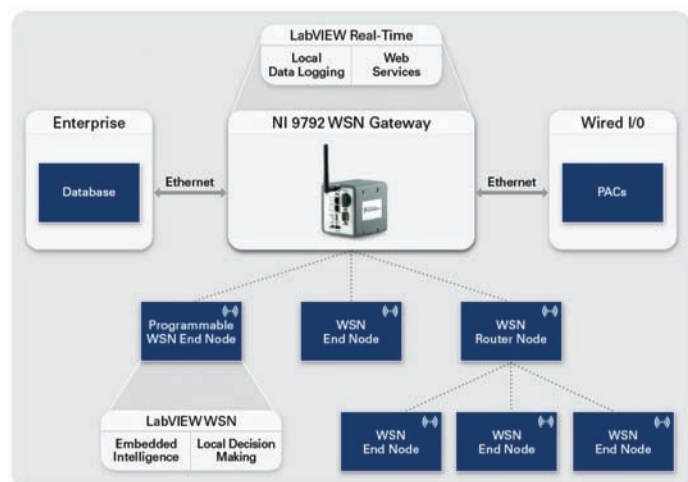




ni.com

National Instruments expande la plataforma NI Wireless Sensor Network

La nueva puerta de enlace WSN y el nodo de medida extienden la capacidad de comunicación y medida.



National Instruments anuncia dos nuevos productos que extienden la capacidad de comunicación y medida de la plataforma NI wireless sensor network (WSN). El nuevo NI 9792 es una puerta de enlace que se puede comunicar tanto con los nodos de medida de NI WSN como con otro hardware a través de una gran variedad de estándares de comunicación abiertos. La puerta de enlace combina un controlador de NI LabVIEW Real Time y un radiotransmisor integrado de WSN de modo que las aplicaciones de LabVIEW Real Time puede correr localmente en la puerta de enlace para agregar datos desde los dispositivos NI WSN, haciendo al NI 9792 ideal para aplicaciones de adquisición de datos embebidas e inalámbricas. Adicionalmente, el nuevo nodo de combinación detector de temperatura tensión /resistencia (RTD) WSN-3226 extiende la capacidad de medida de la plataforma NI WSN para incluir soporte para medidas basadas en resistencia tales como RTDs y potenciómetros

y dota a ingenieros y científicos de la capacidad de combinar medidas de tensión y temperatura en un único dispositivo NI WSN.

La puerta de enlace NI 9792, que se programa a través del Módulo de LabVIEW Real – Time para operación autónoma, presenta un procesador de alto rendimiento a 533 MHz y 2 GB de almacenamiento interno para aplicaciones embebidas de adquisición de datos. La nueva puerta de enlace

también incluye web integrada (HTTP) y servidores de archivos (FTP), que hacen posible el acceso remoto a datos de medida desde dispositivos thin client como teléfonos móviles inteligentes y ordenadores móviles. El NI 9792 incluye un puerto serie RS232 y un doble puerto Ethernet para proveer de conectividad flexible a otros dispositivos como las redes de trabajo inter-empresariales o sistemas cableados de E/S. Con esta flexibilidad, los ingenieros y científicos pueden crear una solución completa cableada e inalámbrica para cubrir las necesidades de la aplicación.

El nuevo nodo de medida WSN-3226 añade medidas basadas en resistencia a la plataforma NI WSN y tiene cuatro canales analógicos de entrada que pueden ser configurados para medidas de ± 10 V por canal o medidas resistivas. El nuevo nodo de medida dota a ingenieros y científicos de la flexibilidad de elección de modos de entrada analógicos de alta velocidad o alta resolución, opti-

mizando el compromiso entre el consumo y el rendimiento de sus aplicaciones. El WSN-3226 también contiene dos canales digitales bidireccionales que se pueden configurar independientemente para entrada o salida de fuente o sumidero de corriente. Adicionalmente, el nodo de medida puede ser alimentado por pilas AA, con una vida útil superior a tres años, o externamente con una fuente entre 5 y 30 V, que ofrece eficiencia mejorada para aplicaciones de captación de energía.

Usando el modulo LabVIEW WSN Pioneer, los ingenieros y científicos pueden personalizar el comportamiento del WSN-3226 añadiendo inteligencia a una vida útil de batería extendida, aumentar el rendimiento de entradas analógicas y digitales, realizar control local, análisis y disminución de datos e interactuar con sensores personalizados. Adicionalmente, la última versión del software del NI WSN, NI WSN 1.2, añade soporte para el WSN-3226 junto con otras características que incluyen actualizaciones más rápidas de firmware, registro del tiempo de los datos más preciso y descarga de variables de E/S automática. El software también trae configuración basada en web de la puerta de enlace NI 9792, eliminando la necesidad del software de aplicación para configurar y poner a punto un WSN.

Los productos NI WSN son ideales para el registro de datos a largo plazo y la monitorización remota en las siguientes aplicaciones:

- Monitorización medioambiental
- Monitorización energética
- Monitorización de edificios
- Monitorización de la salud estructural
- Monitorización distribuida de temperatura
- Transporte
- Monitorización industrial

Conozca más productos nuevos y la plataforma NI WSN y vea el webcast "Creating Intelligent WSN Networks" para aprender cómo construir un sistema completo WSN con LabVIEW en www.ni.com/wsn/esa.

Ref. Nº 1104920

National Instruments apoya a las pequeñas empresas tecnológicas españolas

National Instruments desarrolla un programa de ayuda a las tecnológicas españolas en ciernes

En virtud del Small Business Act europeo de 2008 la legislación europea ha acudido concretamente en ayuda de las pequeñas y medianas empresas europeas. En España estas últimas caracterizan su tejido económico productivo, constituyendo un recurso relevante en términos de potencialidad de ocupación y desarrollo y, hoy más que nunca, necesitan la ayuda de las instituciones. Sin embargo, suele suceder que las empresas proveedoras sean las mismas.

En España, National Instruments se está moviendo activamente para promover y apoyar la creación de nuevas empresas de alta tecnología mediante un 'Programa incubador para las empresas innovadoras españolas'. El objetivo principal es reconocer y seleccionar proyectos empresariales prometedores y ofrecerles ayuda concreta y gratuita. National Instruments, que desde siempre pone sus ojos atentos en las nuevas realidades tecnológicas españolas, ha decidido ofrecer un paquete de propuestas y facilidades con el objetivo de apoyar concretamente la innovación del producto.

Las empresas participantes podrán utilizar la plataforma software NI, como el entorno de programación gráfico NI LabVIEW, totalmente gratuito para toda la duración de la participación en el programa, con la posibilidad de conversión a licencia permanente al final del periodo de incubación. Además se garantizarán descuentos de hasta el 40% en los productos hardware destinados al desarrollo de proyectos y programas de formación y asesoramiento que incluyen jornadas de inicio de la aplicación para los encargados de los trabajos con un técnico de NI. Los desarrolla-

dores también podrán participar en los tres programas de inversión en las empresas españolas de National Instruments: OEM Grant Program, Green Engineering Grant Program y Medical Grant Program.

El programa concederá a las empresas consideradas idóneas, es decir, las empresas que realizan productos o dispositivos comercializados en el mercado y que integran dentro tecnologías de National Instruments, el equivalente de 25.000 € en productos software, programas de formación y asesoramiento técnico con el objetivo de apoyar concretamente la innovación del producto. Además, las empresas preelegidas podrán convertirse en testimonios de National Instruments y presentar sus propios casos de aplicación en la plataforma web, durante los eventos y en las comunicaciones oficiales.

Vea las opciones del programa de incubadoras de National Instruments en www.ni.com/spain/incubadoras.

Ref. N° 1104921

National Instruments proporciona prestaciones de primera clase en el mercado de RF con un factor de forma PXI

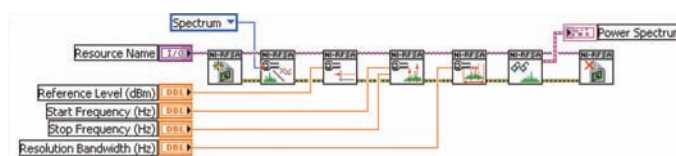
Las prestaciones de los nuevos analizadores vectoriales de señales de RF en formato PXI superan las de los instrumentos tradicionales apilables e instalables en rack

National Instruments ha lanzado hoy el analizador vectorial de señales (VSA) de RF NI PXIe-5665 de 3,6 GHz que ofrece las mejores prestaciones de su clase en un económico factor de forma PXI. Las características del nuevo VSA en cuanto a ruido de fase, nivel medio de ruido, precisión de la amplitud y rango dinámico son de alto nivel. La plataforma PXI de este VSA facilita también el flujo de datos entre colegas, incluye una arquitectura flexible de entradas y salidas múltiples (MIMO) para medidas de fase coherente y ofrece velocidades de medida que son al menos cinco veces más rápidas que



los instrumentos tradicionales apilables e instalables en racks – todo esto hace que sean ideales para las exigentes aplicaciones de pruebas automatizadas de RF.

“No sólo el NI PXIe-5665 VSA es el instrumento de más altas prestaciones de su clase, sino que está disponible a una fracción del coste de los instrumentos tradicionales apilables e instalables en racks,” dijo Phil Hester, vicepresidente senior de investigación y desarrollo de National Instruments. “Puesto que nuestro nuevo analizador de RF en formato PXI combina unas prestaciones de gama alta con una flexibilidad modular en un solo instrumento compacto y asequible, los ingenieros pueden utilizar ahora ese mismo instrumento desde el diseño hasta la producción.”



El VSA combina el nuevo convertidor a baja frecuencia NI PXIe-5603 con el nuevo sintetizador del oscilador local NI PXIe-5653 y el NI PXIe-5622, un digitalizador de frecuencia intermedia (IF) a 150 MS/s. Esta combinación crea una solución ideal para las medidas del espectro y de señales vectoriales de banda ancha sobre un rango de frecuencia de 20 Hz a 3,6 GHz, con anchos de banda de análisis de hasta 50 MHz. El nuevo VSA cuenta con un ruido de fase excepcionalmente bajo de -129 dBc/Hz a 10 kHz de offset y a 800 MHz, un nivel medio de ruido de -165 dBm/Hz, un punto de interceptación de tercer orden de +24 dBm y una precisión de la amplitud absoluta de $\pm 0,10$ dB. Estas especificaciones hacen que el NI PXIe-5665 sea el instrumento de mayores prestaciones de su clase.

Para el análisis de señales moduladas, la exclusiva herramienta de autocalibración incorporada en el VSA permite lograr una respuesta de amplitud en FI de $\pm 0,15$ dB y una linealidad de la fase en FI de $\pm 0,1$ grados. Esta precisión facilita unas prestaciones excepcionales de la magnitud del vector de error menor del 0,21% para una señal de 256 QAM. La arquitectura modular y flexible del VSA se expande para ofrecer una adquisición coherente en fase para las pruebas MIMO, así como una velocidad de barrido del espectro de 20 GHz/s y flujo de datos entre colegas para lograr una monitorización eficiente del espectro. Además, los ingenieros pueden utilizar el NI PXIe-5665 usando su función de modo lista de RF para avanzar de forma determinista a través de un conjunto configuraciones de RF definidas por el usuario usando la sincronización interna o un disparo externo para reducir significativamente el tiempo de prueba.

Debido a que el modelo NI PXIe-5665 se une a una línea de productos de más de 1.500 instrumentos

National Instruments presenta los ordenadores industriales táctiles basados en el procesador Intel® Atom™

Los ingenieros pueden programar HMIs con NI LabVIEW para el despliegue de aplicaciones flexibles y simplificadas



National Instruments anuncia hoy una línea de ordenadores táctiles con un rango extendido de temperatura, basados en el procesador Intel Atom de 1,33 GHz. Con estos procesadores, los ingenieros pueden construir interfaces hombre – máquina (HMI) de alto rendimiento con un dispositivo de bajo consumo sin ventiladores. El NI TPC-2206 y el TPC-2212 tienen un rango de operación de temperatura entre -20 y 60°C para aplicaciones industriales robustas, discos duros de estado sólido de 4 GB para operaciones fiables en medios extendidos de vibración y sistema operativo Windows Embedded para el despliegue y el soporte a largo plazo. También tienen 1 GB de RAM, dos puertos gigabit Ethernet y tecnología de iluminación trasera para mantener el brillo de la pantalla en el rango de temperaturas.

“Los ordenadores táctiles que se lanzan hoy, combinados con el software NI LabVIEW, dotan de un interfaz robusto de alto rendimiento para aplicaciones de monitorización y control”, dice Eric Starkloff, vicepresidente de National Instruments de marketing para test y embebidos.

El uso de los procesadores Intel Atom como base de estos nuevos ordenadores táctiles facilita no sólo su rango extendido

modulares PXI definidos por software, los ingenieros pueden mezclar y combinar el VSA con diversos módulos y controlar todo un sistema de pruebas automatizadas con el software gráfico de diseño de sistemas NI LabVIEW. Esto hace que los sistemas PXI sean ideales para multitud de aplicaciones de pruebas automatizadas. Los ingenieros pueden beneficiarse también plenamente de las prestaciones del VSA definidas por software mediante herramientas de software de RF para LabVIEW, NI LabWindows™/CVI y .NET para probar los últimos estándares de RF y de comunicaciones inalámbricas incluyendo GSM/EDGE, WCDMA, LTE, WLAN y WiMAX.

Aprenda más acerca del VSA modelo NI PXIe-5665 en www.ni.com/xf.

Ref. N° 1104923

de temperatura, sino también su rendimiento de aplicación mejorado.

“Los nuevos procesadores Intel Atom llevan más inteligencia que nunca antes a los dispositivos embebidos conectados, como los ordenadores táctiles HMI”, dice Staci Palmer, directora senior de marketing de la división de procesadores Intel embebidos de bajo consumo. “Los dispositivos que integran servicios inteligentes conectados para monitorizar, sentir, servir y controlar aplicaciones inteligente e interactivamente ayudan a nuestro mundo a operar con mayor eficiencia.”



Los nuevos ordenadores táctiles industriales trabajan con gran variedad de hardware que incluye NI CompactRIO, PXI, NI Smart Cameras, NI Embedded Vision Systems y otros dispositivos industriales de terceros. Los ingenieros pueden desarrollar aplicaciones HMI avanzadas e intuitivas con el entorno de desarrollo gráfico de LabVIEW, que usan para comunicar con su hardware por medio de métodos estándar de comunicación tales como TCP, OPC, USB, Modbus, Ethernet/IP y muchos otros. LabVIEW facilita el despliegue de red, las aplicaciones de plantilla pre construida y los controles de navegación para construir interfaces complejos multipantalla. Los ingenieros también ganan control de programación con las características de los avanzados sistemas operativos como filtros de lectura realizados e Hibernar Una vez/Restaurar Muchas (HORM).

Consulte más acerca de los ordenadores táctiles en www.ni.com/inteltouchpanel.

Ref. Nº 1104924

National Instruments lanza '2011 Automated Test Outlook Report'

Tendencias de los detalles de los informes de la siguiente generación de prueba y medida que afectarán a la industria electrónica

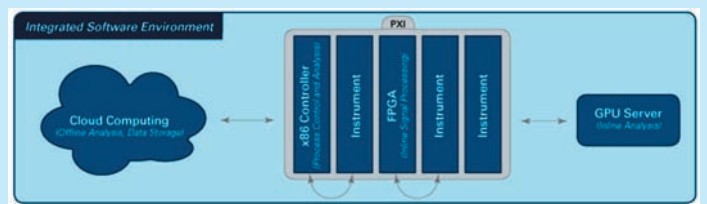
National Instruments ha lanzado hoy '2011 Automated Test Outlook report', que asocia los hallazgos de la investigación de la compañía en tecnologías y metodologías dedicadas a la configuración de pruebas y medidas. Las tendencias de los detalles de los informes son de aplicación en numerosas industrias, incluyendo electrónica de consumo, automoción, semiconductores, aeroespacial y defensa, dispositivos médicos y comunicaciones. Gracias al conocimiento proporcionado por los informes, ingenieros y gerentes pueden aprovechar las recientes estrategias y mejores prácticas dedicadas a la optimización de cualquier estructura de prueba.

'2011 Automated Test Outlook' está basado en las aportaciones de la investigación académica e industrial, foros de usuarios y encuestas, inteligencia comercial y comentarios del consejo asesor de clientes. Tomando estos datos como base, el informe ofrece una amplia representación de la próxima generación de tendencias para afrontar los retos empresariales y técnicos del mercado de prueba y medida. El informe está organizado en cinco categorías: Estrategia de Negocios, Arquitectura, Informática, Software y E/S. Las tendencias principales que se discutieron en el informe de 2011 son las siguientes:

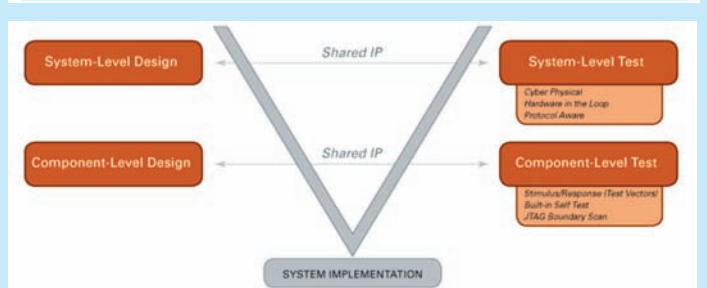
- **Estructura de las pruebas de integración:** La integración de las pruebas de validación y producción requiere un enfoque sobre los cambios en cuanto a estrategia, procesos, personas y tecnología.



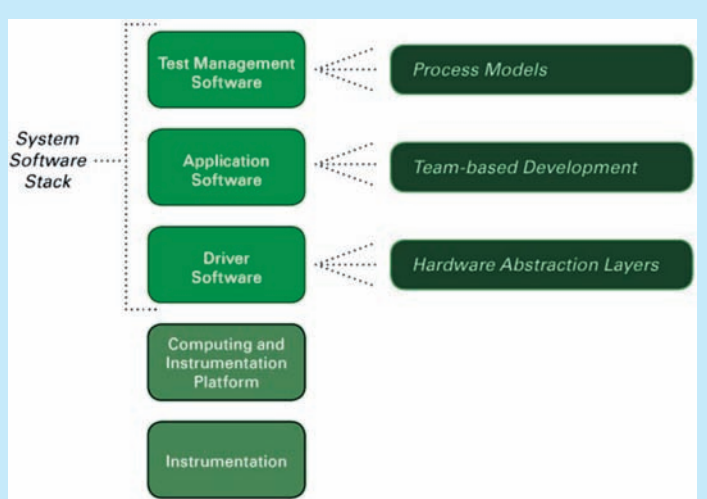
- **Informática heterogénea:** Los futuros sistemas de prueba requerirán diferentes tipos de nodos de procesamiento para hacer frente a las crecientes necesidades de análisis y procesamiento.



- **IP para el Pin:** La posibilidad de compartir IPs (Intellectual Property) de FPGAs (Field-Programmable Gate Array) entre los equipos de diseño y prueba reduce drásticamente la duración del proceso de verificación y validación del diseño y mejora el tiempo de prueba en producción y la cobertura de fallos.



- **Sistema de pila de software:** Un marco de software altamente integrado proporciona una arquitectura flexible del sistema que permite añadir capacidades de medida y reducir el tiempo dedicado a las pruebas.



Para obtener información sobre '2011 Automated Test Outlook', los lectores pueden visitar www.ni.com/ato

Ref. Nº 1104922